非晶質高分子固体薄膜中における単一ゲスト分子の三次元追跡

(大阪大学¹, 富山県立大²) <u>伊都将司¹</u>, 多賀悠平¹, 竹井 敏², 宮坂 博¹ Three-dimensional single molecule tracking of fluorescent guest dyes in polymer thin films

(Osaka Univ.¹, Toyama Prefectural Univ.²) <u>Syoji Ito</u>¹, Yuhei Taga¹, Satoshi Takei², Hiroshi Miyasaka¹

【序】 高分子などの非晶質固体は、マクロな観点からは均一と見なせる場合においてもナノメ ートル(分子)レベルでは空間的な不均一性が存在することはよく知られており、例えばスペク トルホールバーニングやフォトンエコー法などの集団系計測による研究が展開されてきた。しか し分子論的な解明が充分なされたとは言い難く、個々の分子の状態とミクロ環境との相関を計測、 理解することは凝縮相中の分子ダイナミクスを解明する上で重要な課題である。また、高分子材 料をフォトリソグラフィーなどの超微細加工に用いる場合には、高分子固体内部のミクロ不均一 性が加工精度に大きく影響する場合もあるため、ナノメートルスケール程度の高い空間分解能で 高分子固体材料を評価することは応用的にも重要である。我々は近年、凝縮相固体のナノスケー ル空間的不均一性の解明に対して、単一分子蛍光イメージングによるゲスト分子の並進・回転運 動の詳細な解析が有効であることを指摘し、種々の高分子固体材料や、メソポーラスシリカ系材 料を対象に測定を行ってきた[1,2]。しかし、光学顕微鏡によるイメージングは一般に二次元的で あり、基板とゲスト分子、界面とゲスト分子との相互作用がゲスト分子の拡散挙動に与える影響

を評価するには至っていなかった。そこで本研究では高分子固体の界面効果をより詳細に明らかにすることを目的とし、単一 分子蛍光イメージングを三次元に拡張する装置を構築し、ゲス ト分子の並進拡散挙動の測定を行った。

【実験】 レーザーを励起光源とする蛍光顕微鏡の結像光路に シリンドリカルレンズ (f: 300 mm)を挿入し結像系に非点収差 を導入した。これにより、CCDカメラに結像される各蛍光分子 の像は楕円となり、そのアスペクト比が試料中における分子の 光軸方向の位置に依存して変化する[3]。試料として種々のペリ レンビスイミド誘導体 (PDI, BP-PDI)を極微量添加した poly(2-hydroxyethyl acrylate) [polyHEA]薄膜をスピンコート法に よりガラス基板上に作製した。スピンコートで滴下する溶液の ポリマー濃度、スピンコートの回転数を変化させることで膜厚



Fig. 1. Correlation between the Z-positions of a guest dye and shapes of elongated fluorescence spots.

数十 nm から 1 μ m の polyHEA 薄膜を準備した。薄膜作製の際、ポリエチレングリコール鎖を有 する PDI 誘導体(BisPEG-PDI)を親水性相互作用によりガラス基板上に固定することで光軸方向 の位置の基準とした。スポット径を数十 μ m に調整した連続発振レーザー光(波長 488nm or 532 nm)

を試料薄膜に照射し、薄膜中単分子群からの蛍光を高感度 EM-CCD カメラにより撮影した。

【結果と考察】 まず蛍光分子の光軸(Z)方向の変位量とス ポット形状との相関を取得した。参照試料としてペリレンジ イミド誘導体(PDI)を微量含む PMMA 薄膜を用い、試料薄 膜をZ方向に10 nm ずつ移動させて各Z座標に対応する蛍光 像をCCDカメラで取得した。図1にZ座標に対する単一PDI 分子の蛍光スポット形状変化の一例を示す。この測定により 得られた蛍光分子のZ位置と楕円蛍光スポットのアスペクト 比との相関から校正曲線を取得した。

図2に膜厚1µm程度のpolyHEA薄膜中のBP-PDIに対する 単一分子蛍光イメージの一例を示す。この像には、(i)で示さ れた縦長の蛍光スポットと、(ii)で示された横長の蛍光スポッ トが確認できる。縦長のスポットは並進拡散を示さなかった



Fig. 2. (a) A fluorescence image of guest dyes in a polyHEA film and (b) MSD vs. time plots of (i) BisPEG-PDI and (ii) BP-PDI.

ことより、これはガラス基板に強く吸着した BisPEG-PDI であると判断できる。一方、横長のスポ ットは並進拡散を示した。スポット形状が(i)の BisPEG-PDI とは明らかに異なるため、この分子は ガラス基板から離れた位置を拡散している事が分かる。先述の校正曲線より見積もると、この分 子は基板からのおよそ数百 nm 離れた領域を並進拡散することが明らかとなった。また種々の膜 厚の試料における拡散の成分数を累積確率分布を用いて調べたところ、膜厚約 1 µm の試料におい ては膜厚約 80nm の場合と比べて二成分の拡散となる分子が少ない結果が得られた 。講演では、 基板 (界面) からの距離がゲスト分子の並進拡散挙動に与える影響、ゲスト分子に依存した3次 元的な拡散挙動などについても報告し、議論する。

文献

[1] S. Ito et al, *Chem Commum.*, 2009, 6165; S. Ito et al, *APEX 2*, 2009, 075004; 伊都将司·宮坂博, 高分子, 2011, 60, p54.

[2] S. Ito, et al, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 11884.

[3] B. Huang, W. Wang, M. Bates, X. Zhuang, Science, 2008, 319, 810.